## Target Manufacturing and Evaluation of The Optical System for The J-PARC OTR Beam Profile Monitor

Satoru Otsu <sup>#,A)</sup>, Masaki Tejima<sup>B)</sup>, Yoshinori Hashimoto<sup>B)</sup>, Toshiyuki Mitsuhashi<sup>C)</sup> <sup>A)</sup> Mitsubishi Electric System & Service Co., Ltd. 2-8-8 Umezono, Tsukuba, Ibaraki, 305-0045 <sup>B)</sup> KEK/J-PARC 2-4 Shirakata Shirane, Tokai, Naka-Gun, Ibaraki, 319-1195 <sup>C)</sup> KEK 1-1 OHO, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801

#### Abstract

Next January, an OTR (Optical Transition Radiation)-beam profile monitor [1] will be installed at the 3-50 GeV beam transport in J-PARC. Targets for OTR generation are made with thin metal foils, such as aluminum and titanium. Uniformly foil applying method was studied, and then un-flatness of a tested 10-micron titaninum foil was within 30 micron, covering circle area of 90 mm diameter. Optics for OTR light observation employs an Offner type relay-optics consists of two 300mm-diamiter concave mirrors and a 200 mm-diameter convex mirror. On it, focal property and some aberration were investigated for comparing design, and then fine alignment brought large uniformly viewing field of 200 <sup>H</sup> and 90 <sup>V</sup> in mm on each center line. These technics for target manufacturing , and for fine optics measurement and its devices alignment are discussed in this paper mainly.

# OTR プロファイルモニターのターゲットの製作と光学系の評価

## 1. はじめに

OTR ビームプロファイルモニター(図 1)は,ター ゲットフォイルで生成される OTR 光を計測するモ ニターである.本装置では、ターゲットのビーム衝 突点のバックワード方向にオフナー光学系を置いて いる.光のエンベロープは白線で示してある.ター ゲット真下に位置するスクリーンにターゲット像を 結像する.スクリーンは、拡散光に変換する役割を もち.スクリーンの像はミラーを介して大気中の計 測光学系(2次光学系)に導かれる.



ターゲットの金属フォイルは、できるだけ薄く、 平坦であることが望ましい.われわれは、ビームロ スの観点から 10 ミクロン厚みのアルミニウムまた はチタンのフォイルを候補にしている.計測する視 野径は、光学系の設計から 110 mm である.フォイ ルの非平坦性は,結像の形状の偏差が 0.33 mm (光学系の設計分解能 1 mm の 1/3) とした場合に, 50µm 以下であることが要求される.実機でのター ゲットフォイルの全体のサイズは,150 mm の直径 としている.これはビームパイプ内径(160 mm)とほ ぼ同じサイズであり,大強度ビームに何らかの変動 があった場合でもロスを発生させないためである. 現在は貼り付けの試験段階であり,120 mm の矩形 サイズでの均一なフォイル貼り付けの試験を行って いる.

## 2. ターゲットフォイル

2.1 ビームコア用ターゲットフォイルの貼付け

50µm 以下の非平坦性を目標にして,次の2段階の貼り付け方法を試験した.

方法 1.

平坦なガラスの上にクリーンルーム用の静電防止 紙(AS スタクリン:桜井)を敷き、10 μm<sup>4</sup>、150× 150 mm<sup>2</sup>のアルミフォイル(純度 99.5%)を載せる. その上にアルミ製の 10 mm<sup>4</sup>のフレームを載せる. これは表面の非平坦性が 20 ミクロン程度であり, 中央に120 mm 直径の丸穴(ビームホール)を開け てある.ウェイトは、3 方の隅に置き、残る 1 方の 隅のフォイルにその面の接線方向に適度なテンショ ンをかけてから、その直上のフレームにウェイトを 載せて仮固定する.次に、別の隅のウェイトを外し て同様の操作を行う.この手順を繰り返し行いなが らウェイトを 250g から 1kg まで重くしてやる.フ レームとフォイルの接着には、ウレタン系の接着剤 をアセトンで希釈し、面相筆に含ませてフレームと の隙間をなぞることで行う. 毛細管現象により,端 部から 10mm 程度の範囲にわたって接着剤を浸透 させることができる.



図 2. ウェイトとテンションをかけてのアルミフォ イルのフレームへの貼り付け時の様子.

#### 方法 2.

次に, 方法1で張り付けたフォイルの内側に角に R をつけたリングを載せて荷重する(図 3). この ようにすることで, 方法1で残ったたわみをさらに 少なくすることができる.



図 3. 方法 1 で張り付けたフォイルの内側にさらに リングを載せ一様に荷重する方法 : この例ではリ ング,ガラス,分銅で 300g 程度荷重している.



図 4. レーザー変位計を用いた 2 次元平坦性測定装 置

2.2 平坦性の測定

測定精度±7.5µm のレーザー変位計(KEYENCE IL-S025)を用いて、フォイルの平坦性を測定している(図 4).フォイルは実機の使用条件と同じく 垂直に置き、フォイル自身を2次元でスキャンする. フォイルに対向する変位計は不動である.チタン フォイルの測定結果を図5に示す.方法1では下部 に 60 µm 程度の非平坦性が残っている、方法2を 追加することで、内径90mmの範囲では30µm 以 下の変位になった.図(b)では、ほとんどたわみの無 い状態となっており、テンションをかけて平坦性を 持たせる方法のほぼ限界になったと考えられる. 残っているのはフォイル自身の歪みなどではないか と考えている.



図 5. フォイルの平坦性:左縦軸は,測定開始点の Y座標[mm]を示し,実際の変位は右縦軸[µm]で表し てある. (a) 方法 1,(b)方法 2 のそれぞれの結果.

## 3. Offner 光学系の調整と評価

Offner 光学系[1]の概念を図 6 に示す. ターゲットフォイルで発生した OTR 光を対称な位置にある スクリーンに結像させる. 原理的に球面を基本にした対称な光学系であるために,収差も比較的小さく 良好な結像性能を持っている. 設計の視野と解像度 は,それぞれ 100,1 mm 程度である.

#### 3.1 光学系の調整方法

製作した Offner 光学系を図7に示す,2枚の凹面鏡 ( $\phi$ 300 mm,r 500 mm:設計値)と1枚の凸面鏡( $\phi$ 200 mm,r 250 mm:設計値)は,基材のパイレックスガラ スを研磨し,その表面全体にアルミコートし導電性 を持たせている.ビームや2次電子によるチャージ アップを防ぐためである.透過波面精度は8/ $\lambda$ であ る.精度良く配置するために,図のように矩形のミ ラーホルダー(寸法精度:0.1mm)に収めている.光学 系要素の配置調整では,まず,凸面鏡を外した状態 で,凹面鏡2枚(上鏡:凹U,下鏡:凹B)の配置 を決定し,両者の焦点位置にずれが無いように調整 し,次に凸面鏡を取り付けその位置を調整した.



図 6. Offner 光学系概念図



図 7. ミラーボックスと Offner 光学系アッセンブリ

#### 3.2 凹面鏡の位置調整と焦点距離の測定

2 枚の凹面鏡は、図にある球心からの距離(R) 500mmの円弧上に載せることが Offner 光学系のポ イントである. 鏡の製作段階に得られた R は 495 mm であり、設計値とのズレは 1%であった. ミ ラーホルダーでは、凹面鏡のミラーベースに角度と 位置精度を持たせ、このベースに平行となるように ミラーをセットすることで **R500** の円弧に沿ってミ ラーが配置されるようにしてある.

次に、図8のようにレーザー墨出し器の縦ライン を用いて、2枚の凹面鏡にレーザー光をスイープし、 その焦点位置のファインな調整を行った.図(b)にあ るように上下のミラーからの反射光の焦点スポット は、アクリルターゲット上で同時に焦点を結び、両 者は光学対称平面(ミラーボックスの中央)を示す. ファイン調整では、ミラー固定部にあるそれぞれ 4 か所のあおり調整機構をわずかに変位させることで 理想的な焦点の状態となった.メディアンプレーン 上にあるハイトゲージのエッジに対して対称な位置 にあることから、両ミラーの関係が対称であること も確認した.



図 8. レーザー墨出しを用いた凹面鏡の位置調整. (a) 垂直方向レーザーによるスイープ,(b)アクリル ターゲット上での入射レーザーラインと2つの凹面 鏡の焦点スポット

焦点位置を正確に計測する方法としては、精度の 高い Foucault のナイフエッジ法[2]を用いた.測定 原理は、図9である.焦点の前方と後方に置いたナ イフではシャドウの位置が正反対になる.ナイフが 丁度焦点に来るとき、全波面がシャドウとなる.ナ イフの厚みは 0.1mm 以下であるので、正確な焦点 位置がわかる.



図 9. ナイフエッジ法により焦点 F をもつ凹面鏡の 波面の測定:ナイフエッジを a (焦点より後方)に入 れるとき,図の上側からナイフのシャドウが現れ る.焦点前方の a の場合は、シャドウは逆になる.

ナイフエッジ測定器とセットアップを図 10 に示 す.光源には 50 ミクロンのピンホールを用い,カ ミソリのブレードを精密位置調整できる機構を持っ ている.測定は,エッジの直後方に目(またはレン ズ付カメラ)を位置させて,その焦点を凹面鏡の鏡 面に合わせる.図のセットでは凹 U と凹 B を同時 に計測することができる.この方法では,上下の凹 面鏡の焦点位置は,0.5mm 程度の違い程度で一致 していることを確認した.



図 10. ナイフエッジ法により鏡面波面の測定と焦点 位置の測定, (a) セットアップ, (b) 測定ヘッド

#### 3.3 ロンキーテスト[2]

凹面鏡の収差による波面のエラーを評価するため に、ロンキーターゲットによる試験を行った.使用 したロンキーターゲットのラインピッチは 5 line/mm である.図 10 のナイフエッジセットのナ イフを外し、ターゲットをセットする. CCD カメ ラの焦点は凹面鏡のやや手前に来るように(前方主 点の近傍)セットすることでターゲットにおける回 折と干渉のロンキーグラムを見ることができる(図 11).得られた像は、ラインが直線で等間隔に並ん でいることから顕著な球面収差や非点収差がないこ とを確認した.凹Uでも図 11 同様であった.



図 11. 凹 B のロンキーグラム

#### 3.4 グリッドパターンテスト

3.3 までの方法で凹面鏡の良好な対称性と収差の 少ないことを確認した後、凸面鏡をとりつけての Offner 光学系としての総合試験を、グリッドパター ンを用いて行った.10mm グリッドのターゲットを、 スクリーン位置にセットし、フォイルターゲット位 置近傍でトレース紙ターゲットに結像させた.結像 位置は、デザインより30mm 程度短いことがわかっ た.これは特に問題にはならないが、その理由とし て研磨した鏡の厚みやその焦点距離の設計値からの ずれなどが効いていると考えている.また焦点深度は、5 mm 程度と非常に浅く、これは大きな開口をもつためである.

光学系の結像性能(図 12)は良好であることがわ かった.視野は、写真に写っているスケールの mm の刻みのラインが識別できるかを判断した場合は、 次の結果となった.十字位置が光軸の中心であり、 その中心を通る縦軸と横軸上においては、垂直方向 に+30/-60 mm、水平方向に±100 mm にわたる良好 な結像の視野であった.垂直方向の+側が 30mm とやや小さいが、中心平面から距離の遠い側(図の 上側)にわずかなボケが発生しているためである. 300mm の大きな鏡を使用するため Offner 光学系の 設計における分解能は、1mm としていることから、 その精度とした場合の視野は、図からわかるように、 垂直上側でも 50 mm 近くまでの視野は持っている といえる.



図 12. グリッドパターンテスト

### 4. まとめ

10 µm 厚みのチタンフォイルのフレームへの貼り 付け試験では、リング状の荷重を追加することで平 坦性を増す工夫がなされ、90mm 直径の円領域で 30 µm 以下の非平坦性を実現した. 今後は、実機に 向けて、120mm の領域の平坦性を確保する試験を 行う予定である.

Offner 光学系では,光学系を構成する凹面鏡と 凸面鏡のファインな調整が行われ,設計の分解能 1 mm を実現し,100mm 直径領域以上の視野がある ことを確認できた.

## 参考文献

- [1] M. Tejima, et al., These Proceedings.
- [2] D. Malacara, Edited, "光学実験・測定法 I", 2010, アド コム・メディア.